

Technical Sheet

No. 22-31

微小部X線結晶構造解析装置

キーワード:単結晶構造解析、マイクロフォーカスX線源、光子計数型ハイブリッドピクセル検出器

はじめに

微小部 X 線結晶構造解析装置は、微小な単結 晶試料に X 線を照射し、原子の周期配列による 回折現象を利用して、分子構造、結構造を決定する装置です。分子の構造その あり、極めて強力な分析手法と言えま機化の方法と言えま機化合物、タンパク質(比較的力な分析・当然と言えま機化的分子質(比較的分子量の小さいもの)など、に関するデータは、気に関するデータは、大学反応性から人体との相互に を発表で、あらゆる性質に関連するために 種造解析は幅広い分野で利用されています。

これまで、結晶構造解析は測定に長時間を要するものであり、当研究所でも一日がかりでした。しかし最近では、装置の進歩によって測定時間が大幅に短縮され、1時間以内に測定完了できるケースが多くなりました。また実効焦点があるケースが多くなりました。また実効焦点があるかした。ここでは、公益財団法人JKAの令和4年度設備拡充補助事業によって当研究所森之宮センターに設置された、微小部X線結晶構造解析装置(株式会社リガク製 XtaLAB Synergy-S)について、概要と特徴を紹介します。



図1.微小部 X 線単結晶構造解析装置の外観

微小部X線結晶構造解析装置の構成と特徴

本装置の外観を図1に、測定部の拡大図を図2に示します。装置構成は、X線源、結晶マウント部、検出器からなっており、別途試料吹付温調装置が備えられています。

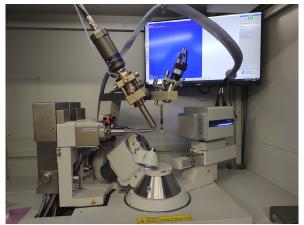


図 2 . 扉内測定部の拡大図 デュアルソース X 線源 (手前が Cu、奥が Mo) 、 型ゴニオメータ、 CCD カメラ、 PC ディスプレイ、 ハイブリッドピクセル検出器、 試料吹付温調装置

X線源には銅(Cu)とモリブデン(Mo)の2種類のマイクロフォーカスX線管を備えており、ソフトウェアから選択するだけで切り替えが可能です(図2)。高速測定には高強度のCu線源を用い、高分解能測定には波長の短いMo線源を用います。 X線の照射径は Cu が約0.25 mm、Moで約0.20 mmです。また、Cu線源には発散角最適化スリットを備えており、タンには発散角最適化スリットを備えており、タンパク質結晶などの格子が大きく、回折スポットが混みあう測定の場合に、スポットを小さにでデータの質を向上します。結晶マウントボスキャピラリを用いてサンプリングします。スキャピラリを用いてサンプリングします。スキャピラリを用いてサンプリングします。スキャピラリを用いてサンプリングします。

公益財団法人 JKA 2022 年度 機械設備拡充補助事業



Phone: 06-6963-8181 (技術相談専用電話)

これをゴニオヘッドと呼ばれる試料台に装着 して、本体の型ゴニオメータ(図2)に取 り付けます。 型ゴニオメータは 軸、

軸を備えており、これらの軸を制御してサン プルを回転させ、必要な回折を測定します。試 料の位置合わせは、CCD カメラ(図2)で拡 大した画像を見ながら行いますが、サンプル室 内にも PC ディスプレイ(図2)を備えている ため、作業が容易です。参考としてガラスキャ ピラリにマウントした 0.2×0.2×0.2 mm 程度 のシチジン標準結晶の CCD カメラ像を図3に示 します。図中の円の直径は 0.3 mm です。検出器 には、高速、高感度、低ノイズ、広いダイナミ ックレンジを備えた光子計数型ハイブリッド ピクセル検出器(図2)を搭載しており、回 折像の読み出し時間がない「シャッタレス測定」 によって高速測定を実現しています。図4にシ チジン標準結晶の回折像の一部を示します。回 折がスポットとして得られていることがわか ります。

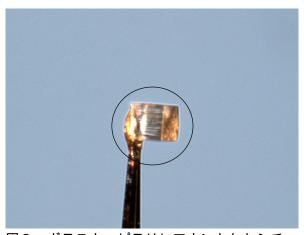


図3.ガラスキャピラリにマウントしたシチ ジン標準結晶の CCD カメラ像

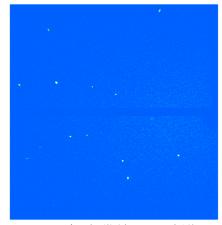


図4.シチジン標準結晶の回折像の一部

X線結晶構造解析は、冷却によって分子の熱 振動が抑えられ、データの質が向上するため、 近年では多くの場合 100 K(-173) などの低 温で測定します。本装置には試料吹付温調装置 Cobra (Oxford Cryosystems 社製、図 2)を 備えており、80 K(-193)~400 K(127) の範囲で測定ができます。また、オイルを用い てマウント用ループ内に結晶を保持する場合 は、測定中に流動しないように冷却凍結するこ とが必須です。

単結晶構造解析のこれからの用途

本機器は、大阪地域の幅広い業種の中小企業 の新材料や新製品の研究開発及び製品の品質 向上に役立つものであり、具体的には以下のよ うな用途で利用することができます。

- ・ 食品やファインケミカルなど、製品そのもの が結晶である材料の構造解析
- ・ 低分子医薬品や農薬など、晶析によって精製 される材料の構造解析
- ・ 有機電子材料やナノカーボンなど、分子パッ キングが物性向上に重要な材料の構造解析
- ・ 多孔性配位高分子 / 有機金属構造体など、不 溶性の結晶性固体材料の構造解析
- ・無機塩や無機電子材料など、結晶性無機材料 の構造解析

おわりに

結晶構造は以前から国際的にデータベース 化が進められてきた分野でもあり、ケンブリッ ジ結晶構造データベース (Cambridge Structural Database: CSD) やタンパク質構造 データバンク (Protain Data Bank: PDB) にも 容易にアクセスできるため、データサイエンス の側面からも今後の発展が期待されます。また、 今回は紹介していませんが、回折データから結 晶構造を解析するソフトについても、Olex2(非 商用の場合は無償)などの優れたものがインタ ーネットから入手可能であり、汎用スペックの PC であっても、解析を行うことが可能になって きています。

このような周辺技術の進歩と、測定時間の大 幅な短縮、測定可能な結晶サイズの微小化によ って、X線結晶構造解析は、「手軽に使える」 装置になってきました。もしご興味がありまし たら、お気軽にお問い合わせください。

発行日 2023年3月10日

作成者 電子材料研究部 ハイブリッド材料研究室

柏木 行康、中村 優志 有機材料研究部 ファインケミカル材料研究室 中尾 秀一

Phone: 06-6963-8025 E-mail: kasiwagi@orist.jp